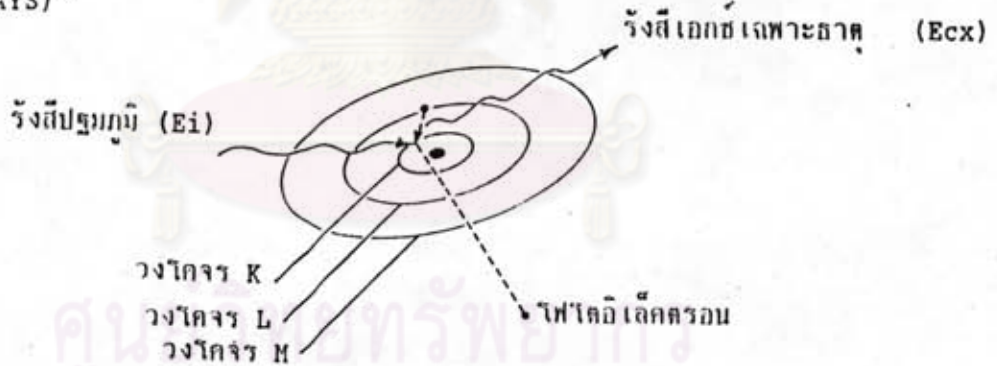




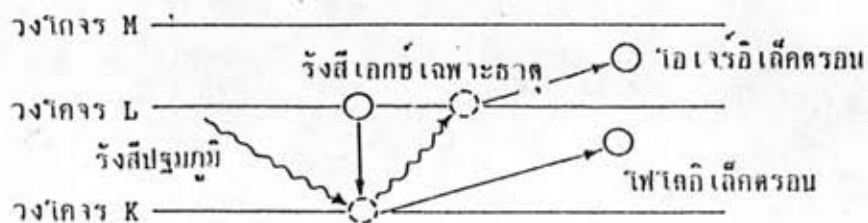
หลักการเรื่องรังสีเอกซ์และระบบในการวิเคราะห์แบบเรืองรังสีเอกซ์(1)

2.1. หลักการเรืองรังสีเอกซ์

การทำให้อิเล็กตรอนในวงโคจรที่อยู่ใกล้นิวเคลียส เช่น วงโคจร K และ วงโคจร L เกิดไอออไนเซชัน (IONIZATION) นั่นคือ หลุดออกจากอะตอมโดยการยิงรังสีปฐมภูมิ (PRIMARY RADIATION) เข้าไป อิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้ เรียกว่า โฟโตอิเล็กตรอน (PHOTOELECTRON : เรียกตามอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริกที่รังสีเอกซ์ถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน) การเกิดโฟโตอิเล็กตรอนทำให้เกิดที่ว่าง (VACANCY) ขึ้นในวงโคจรชั้นที่ว่างดังกล่าวจะมีอายุเพียงประมาณ 10^{-15} วินาที เพราะจะมีอิเล็กตรอนในวงโคจรถัดไป ซึ่งมีพลังงานสูงกว่ากระโดดเข้ามาแทนที่พร้อมกับปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่า "รังสีเอกซ์เรือง (FLUORESCENT X-RAYS)" และเรียกกระบวนการเกิดรังสีเอกซ์เรืองว่า "การเรืองรังสีเอกซ์" (X-RAY FLUORESCENCE) เนื่องจากพลังงานของรังสีเอกซ์เรืองนั้น มีค่าเฉพาะสำหรับธาตุแต่ละชนิด จึงเรียกรังสีเอกซ์เรืองอีกชื่อหนึ่งว่า "รังสีเอกซ์เฉพาะธาตุ (CHARACTERISTIC X-RAYS)"



รูปที่ 2.1.ก. แสดงการเกิดรังสีเอกซ์เรือง



รูปที่ 2.1.ข. แสดงการเกิดไอเจอร์อิเล็กตรอน (1)

จากรูปที่ 2 ก ถ้า $E_i =$ พลังงานของรังสีปฐมภูมิ
 $E_k =$ พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนในวงโคจร k
 และ $E_p =$ พลังงานของโฟโตอิเล็กตรอน
 โดยที่ $E_i > E_k$, จะได้ $E_p = E_i - E_k$
 ถ้า $E_l =$ พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนในวงโคจร L
 $E_{cx} =$ พลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุ
 จะได้ $E_{cx} = E_l - E_k$

ถ้าพลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุที่เกิดขึ้นมีค่ามากกว่าพลังงานของอิเล็กตรอนในวงโคจรรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุจะไปชนกับอิเล็กตรอนในวงโคจรให้หลุดออกไปทำให้เกิดที่ว่างขึ้นอีก เราเรียกอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปว่า โอลิเจอร์อิเล็กตรอน (AUGER ELECTRON) ดังรูปที่ 2.1 ข

2.1.1 ฟลูออเรสเซนซ์ยิลด์ (FLUORESCENCE YIELD)

คืออัตราการเกิดของรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุต่ออัตราการเกิดที่ว่างในวงโคจรของอิเล็กตรอนนั้น

$$\text{ฟลูออเรสเซนซ์ยิลด์ของวงโคจร K (Pk)} = \frac{\text{อัตราการเกิดรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุ}}{\text{อัตราการเกิดที่ว่างในวงโคจร K}}$$

2.2 ระบบในการวิเคราะห์แบบเรืองรังสีเอกซ์

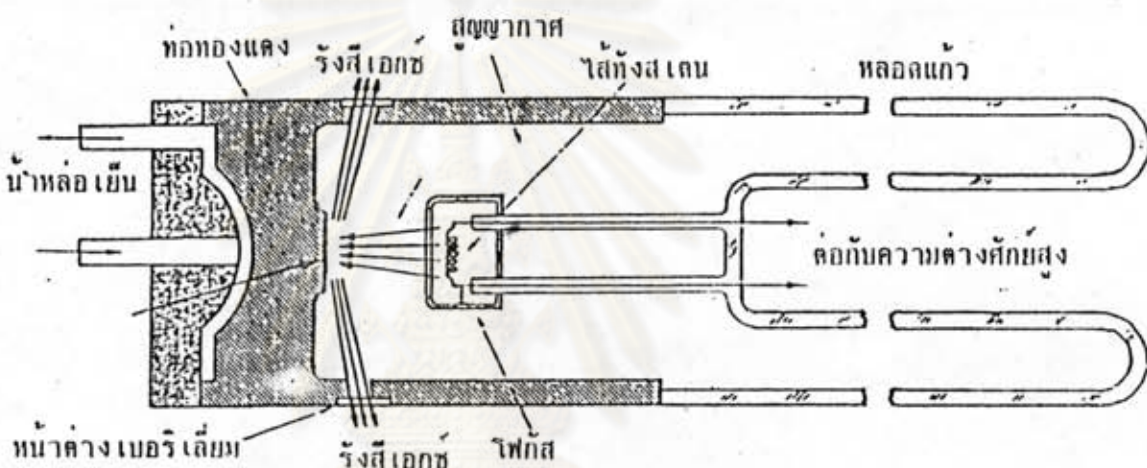
2.2.1 ระบบเวฟเลงท์ดีสเพอร์สिव (WAVELENGTH DISPERSIVE SYSTEM) เป็นระบบที่มีการจำแนกพลังงานของรังสีเอกซ์ธาตุในผลึกเดี่ยว (SINGLE CRYSTAL) เช่น ลิเทียมฟลูออไรด์ (LiF : LITHIUM FLUORIDE) หรือ โซเดียมคลอไรด์ (NaCl; SODIUM CHLORIDE) ทำหน้าที่สะท้อนแยกพลังงานของรังสีเอกซ์เรียงที่ตกกระทบ ผลึกตามหลักการของคลื่นสร้างเสริมและคลื่นหักล้าง (CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE INTERFERANCE) คลื่นที่สะท้อนออกจากผลึกจะเสริมกันเมื่อค่าความยาวคลื่น (λ) ของรังสีเอกซ์มีความสัมพันธ์กับมุมตกกระทบหรือมุมสะท้อนตามสมการ $2d \sin \theta = n\lambda$ โดยที่ d คือระยะห่างระหว่างระนาบอะตอมของผลึก, θ คือมุมตกกระทบของรังสีเอกซ์และ n คือค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวกใด ๆ เช่น 1, 2, 3,

2.2.2 ระบบเอนเนอร์ยีดีสเพอร์สिव (ENERGY DISPERSIVE SYSTEM) เป็นระบบที่มีการจำแนกพลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุในตัววัดรังสีซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุให้เป็นความต่างศักย์ของพัลส์ (PULSES) ซึ่งมีขนาดเป็นปฏิภาคกับพลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุ

ส่วนประกอบหลักของระบบ เอนเนอร์ยีดีสเพนส์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

2.2.2.1 ต้นกำเนิดรังสีกระตุ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.2.2.1.1 หลอดกำเนิดรังสีเอกซ์ มีลักษณะ เป็นหลอดแก้วสุญญากาศ ดังรูปที่ 2.2 เมื่อขั้วลบถูกต่อเข้ากับศักดาไฟฟ้าแรงสูง อิเล็กตรอนจากขั้วลบจะหลุดออกมาแล้ววิ่งไปชนกับขั้วบวกซึ่งทำเป็นแผ่นโลหะ เรียกว่า เป้า (TARGET) ก็จะเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่อง หรือ เบรมสตราลุง (BREMSSTRAHLUNG) และใช้เป็นต้นกำเนิดรังสีกระตุ้น



รูปที่ 2.2 แบบภาพตัดขวางหลอดกำเนิดรังสีเอกซ์ (ฟ)

2.2.2.1.2 ต้นกำเนิดรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมาชนิดไอโซโทปรังสี แบ่งออกเป็น 3 พวก คือ

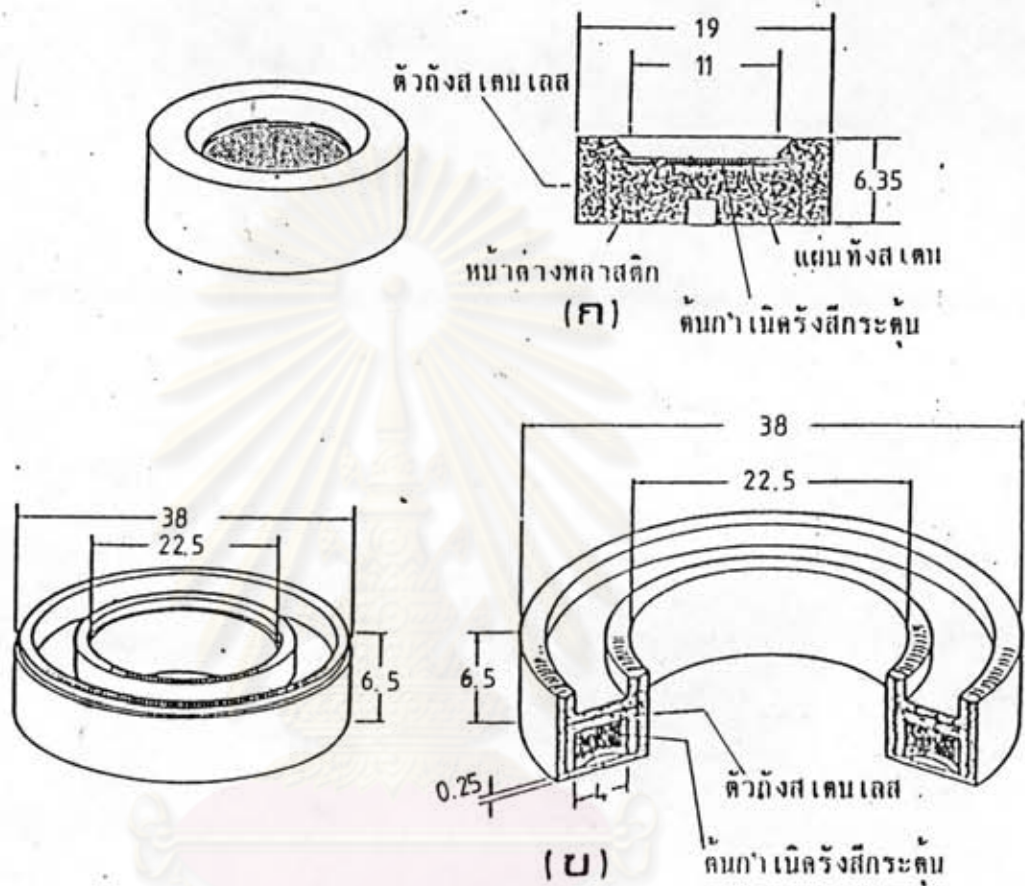
2.2.2.1.2.1 ต้นกำเนิดรังสีที่ให้ฟลอคอนพลังงานต่ำ (LOW ENERGY PHOTON SOURCE)

2.2.2.1.2.2 ต้นกำเนิดรังสีประเภทอิเล็กตรอนแคปเจอร์ (ELECTRON CAPTURE SOURCE) ตารางที่ 1. ในภาคผนวก

2.2.2.1.2.3 ต้นกำเนิดรังสีแกมมา (CONTINUOUS X-RAY SOURCE หรือ BREMSSTRAHLUNG SOURCE) ตารางที่ 2. ในภาคผนวก

ลักษณะของคัมภาเบ็ดรังสีแบบไอโซโทปประดิษฐ์

- แบบจุดหรือแบบแผ่น (POINT SOURCE หรือ DISC SOURCE)
- แบบวงแหวน (ANNULAR SOURCE หรือ RING SOURCE)



รูปที่ 2.3 แสดงลักษณะของคัมภาเบ็ดรังสีชนิดไอโซโทป (ขนาดบอกเป็น มม.)
(ก) แบบแผ่น, (ข) แบบวงแหวน (ง)

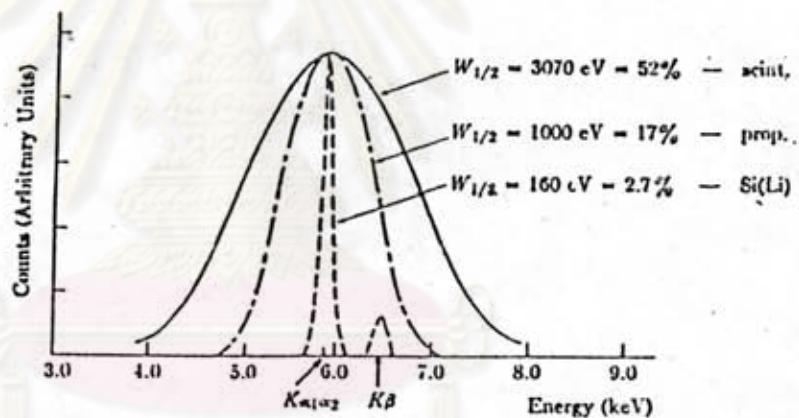
2.2.2.2 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น

- ตัวอย่างบาง โดยมากจะใช้กับตัวอย่างที่เป็นของเหลวที่มีปริมาณน้อย ๆ หรือพวกแก๊สต่าง ๆ
- ตัวอย่างหนา ซึ่งจะต้องมีความหนาของตัวอย่างมากกว่าความหนาวิกฤต (CRITICAL THICKNESS; ความหนาของตัวอย่างที่ทำให้ความเข้มของรังสีเอกซ์เรืองมีค่าเท่ากับ 95% ของความเข้มสูงสุด) โดยมากจะใช้กับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง หรือ เป็นผง

2.2.2.3 ส่วนของระบบวัดและการวิเคราะห์รังสีเอกซ์ ประกอบด้วย

- หัววัดรังสีเอกซ์ (X-RAY DETECTOR)
- ภาคขยายส่วนหน้า (PREAMPLIFIER)
- ภาคขยายหลัก (AMPLIFIER)
- เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ (ANALYZER)

หัววัดรังสีเอกซ์ทำหน้าที่แจกแจงพลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะธาตุ ซึ่งความสามารถในการแจกแจงพลังงาน (ENERGY RESOLUTION) และประสิทธิภาพของหัววัดนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของหัววัดที่ใช้ หัววัดที่มีความสามารถในการแจกแจงพลังงานดี ก็จะมีประสิทธิภาพไม่ต่ำ ดังรูปที่ 2.4 สัญญาณจากหัววัดรังสีจะถูกป้อนและขยายโดยภาคขยายส่วนหน้าและภาคขยายหลัก และถูกส่งไปยังเครื่องวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่อง (MULTI-CHANNEL ANALYZER, MCA) หรือเครื่องวิเคราะห์แบบช่องเดียว (SINGLE CHANNEL ANALYZER, SCA)



รูปที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแจกแจงพลังงานของหัววัดรังสีทั้ง 3 ชนิด (1)

หัววัดรังสีเอกซ์ที่ใช้กันอุมมี 3 ชนิด คือ

2.2.2.3.1 หัววัดรังสีเอกซ์ชนิดเรืองแสง (SCINTILLATION DETECTOR)

ไ้แก่ หัววัดโซเดียมไอโอไดด์ (NaI (Tl)) แบบบาง มีความสามารถในการแจกแจงพลังงานไม่ต่ำ โดยมีความสามารถในการแจกแจงประมาณ 52% ที่ 5.9 keV เหมาะสำหรับใช้วัดพลังงานต่ำ ๆ ตั้งแต่ 4.5 keV ขึ้นไป (Ti-K α) และธาตุที่จะวิเคราะห์จะต้องมีความแตกต่างของเลขอะตอม (ATOMIC NUMBER) ประมาณ 7-10

2.2.2.3.2 หัววัดรังสีเอกซ์ชนิดบรรจุก๊าซ เป็นหัววัดรังสีเอกซ์ที่เหมาะสม การวัดพลังงานต่ำ ได้แก่ หัววัดรังสีเอกซ์แบบพรอพอร์ชันแนล (PROPORTIONAL DETECTOR) ที่บรรจุก๊าซอาร์กอน (ARGON, Ar), ซีลอน (XENON, Xe), คริปทอน (KRYPTON, Kr) หรือ มีเทน (METHANE, CH₄) เมื่อใช้หน้าต่างเบริลเลียม (Be-WINDOW) หนา 0.05 มม. จะสามารถวัดพลังงานตั้งแต่ 1.74 keV (Si-K α) สำหรับพลังงานที่ต่ำกว่าจะใช้หัววัดรังสีเอกซ์แบบพรอพอร์ชันแนลโฟลว์เคาน์เตอร์ (PROPORTIONAL FLOW COUNTER) ซึ่งอาจจะบรรจุก๊าซดังกล่าวหรือก๊าซผสมของฮีเลียม-มีเทน (HELIUM-METHANE, He-CH₄), อาร์กอน-มีเทน (ARGON-METHANE, Ar-CH₄), ซีลอน-มีเทน (XENON-METHANE, Xe-CH₄) หรือ ฮีเลียม-ไอโซบิวเทน (HELIUM-ISOBUTHANE) โดยมีอะลูมิเนียมเคลือบบนเทอร์ริลีน (TERRYLENE) หนา 0.006 มม. เป็นหน้าต่างสามารถวัดพลังงานตั้งแต่ 1.25 keV (Mg-K α) ส่วนพลังงานที่ต่ำกว่านี้อาจใช้หน้าต่างโคลโลเดียน (COLLODION WINDOW) หรือไม่มีหน้าต่างเลย (WINDOWLESS)

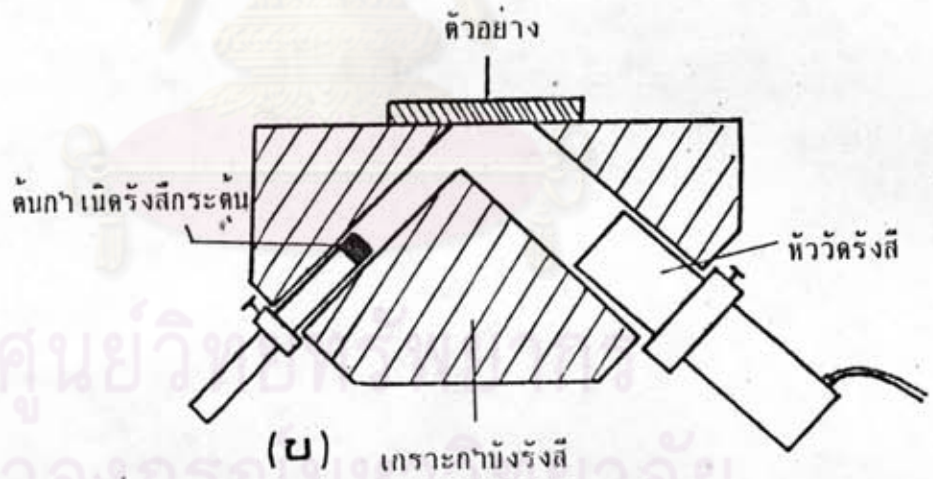
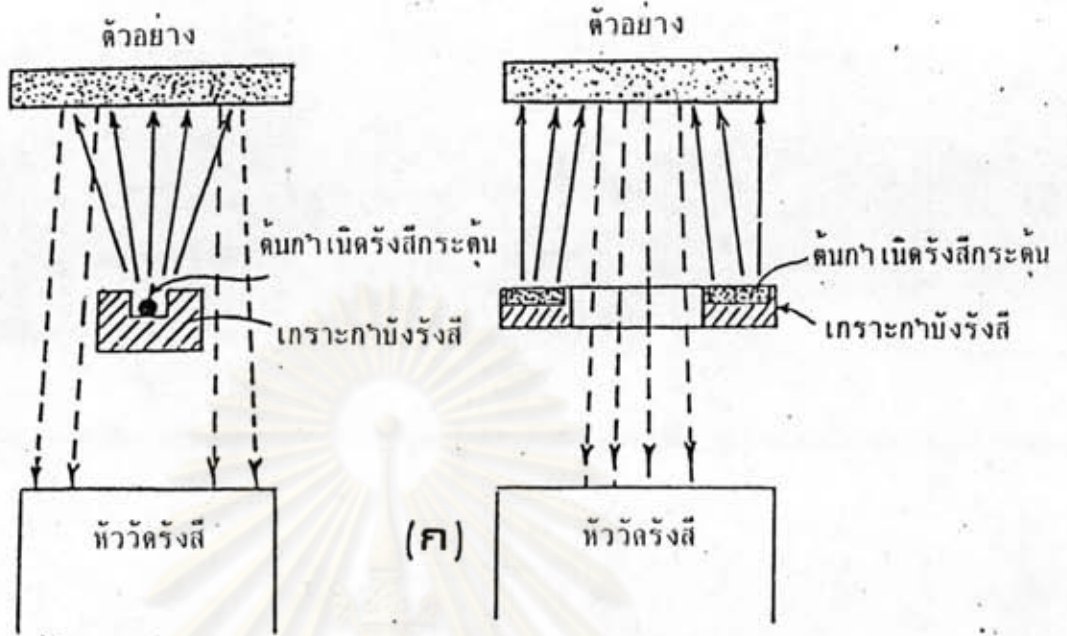
โดยทั่วไปหัววัดชนิดนี้มีความสามารถในการแจกแจงพลังงานปานกลาง โดยมีค่าความสามารถในการแจกแจงพลังงานประมาณ 16% ที่ 5.9 keV และธาตุที่จะวิเคราะห์จะต้องมีความแตกต่างของเลขอะตอมประมาณ 2-3

2.2.2.3.3 หัววัดรังสีเอกซ์ชนิดกึ่งตัวนำ ซึ่งแบ่งเป็นลิเทียมดริฟต์ซิลิกอน (Si(Li):LITHIUM DRIFTED SILICON), ไฮเปอร์เพียวหรือไฮเพียวริตี้เจอร์เมเนียม (HPGe:HYPERPURE OR HIGH PURITY GERMANIUM) และลิเทียมดริฟต์เจอร์เมเนียม (Ge(Li):LITHIUM DRIFTED GERMANIUM) หัววัดแต่ละชนิดจะใช้ในการวัดพลังงานสูงขึ้นไปตามลำดับ หัววัดรังสีเอกซ์ชนิดนี้มีความสามารถในการแจกแจงพลังงานดีที่สุดในแง่ความสามารถในการแจกแจงพลังงานประมาณ 2.7% ที่ 5.9 keV จึงสามารถวิเคราะห์ธาตุที่มีเลขอะตอมติดกันได้

2.2.3 การจัดวางระบบวิเคราะห์ (GEOMETRY OF ARRANGEMENT)

2.2.3.1 โคนอกเซียลจีโอเมตรี (COAXIAL GEOMETRY) คือระบบที่ทั้งหัววัดรังสีเอกซ์และตัวกำเนิดรังสีและตัวอย่างอยู่ในแนวเดียวกัน

2.2.3.2 นอกโคนอกเซียลจีโอเมตรี (NONCOAXIAL GEOMETRY) คือระบบที่หัววัดรังสีเอกซ์และตัวกำเนิดรังสีจะตั้งอยู่ในแนวเดียวกัน



รูปที่ 2.5 แสดงแผนผังการจัดระบบวิเคราะห์

(ก) การจัดแผนผังแบบโคเอก เซียมลจ้อ เมตร

(ข) การจัดแผนผังแบบเบนยาคอก เซียมลจ้อ เมตร (1)